



君芯科技
CAS-IGBT

KWBW25N120F4EG

1200V 25A 沟槽栅场截止型IGBT

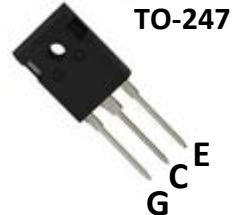
特征

饱和压降为正温度系数，易于并联使用

内置快恢复二极管

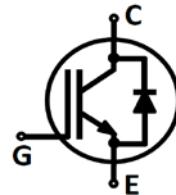
高可靠性及热稳定性，良好的参数一致性

极低的关断损耗



应用领域

逆变焊机、UPS等



最大额定值¹

参数	符号	额定值	单位
集电极-发射极电压 $T_c=25^\circ\text{C}$	V_{CE}	1200	V
集电极电流 $T_c=25^\circ\text{C}$	I_C	50 ²	
$T_c=100^\circ\text{C}$		25	
集电极脉冲电流	I_{Cpuls}	75* ³	
RBSOA电流 $V_{CE}<1200\text{V}, T_j<150^\circ\text{C}$	I_{Cpeak}	75*	A
二极管正向电流 $T_c=25^\circ\text{C}$	I_F	50 ²	
$T_c=100^\circ\text{C}$		15 ²	
二极管脉冲电流	I_{Fpuls}	45*	
栅极-发射极电压	V_{GE}	± 20	V
耗散功率 $T_c=25^\circ\text{C}$	P_{tot}	216	W
$T_c=100^\circ\text{C}$		86	
工作结温	T_j	-55~150	
储存温度	T_{stg}	-55~150	°C

¹测试标准参考JESD-022

²受限于邦定线

³加*表示估计值，下同

⁴允许短路次数:<1000; 短路时间间隔:>1s

热学特性

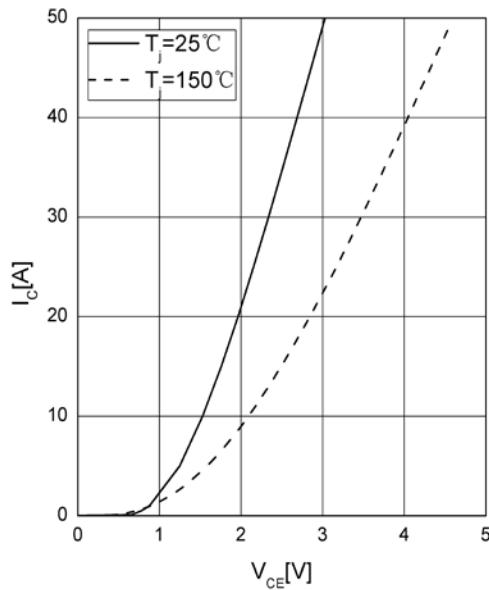
参数	符号	封装形式	最小值	典型值	最大值	单位
IGBT结壳热阻	R_{thJC}	TO-247	-	-	0.58	K/W
二极管结壳热阻	R_{thJCD}	TO-247	-	-	1.5	
结-环境热阻	R_{thJA}	TO-247	-	-	40	

电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

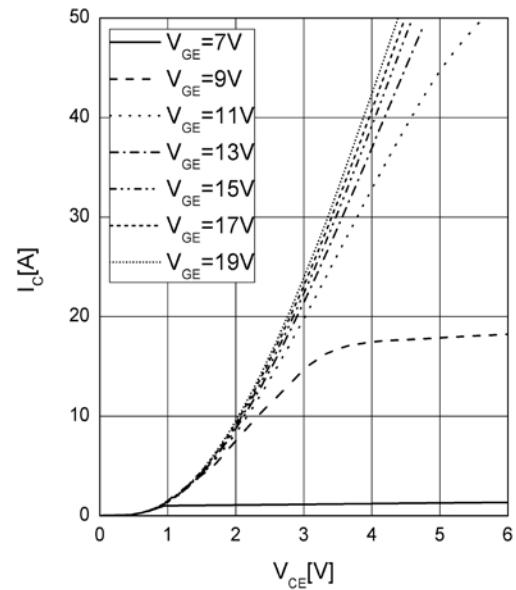
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
击穿电压	$V_{(BR)CES}$	$V_{GE}=0\text{V}, I_C=0.5\text{mA}$	1200	-	-	V
IGBT导通压降	$V_{CE(\text{sat})}$	$V_{GE}=15\text{V}, I_C=25\text{A}$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=150^\circ\text{C}$	-	2.1	2.8	
二极管正向压降	V_F	$V_{GE}=0\text{V}, I_F=25\text{A}$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=150^\circ\text{C}$	-	4.7	-	
阈值电压	$V_{GE(\text{th})}$	$I_C=1\text{mA}, V_{CE}=V_{GE}$	5	6.1	6.5	
集电极-发射极漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=150^\circ\text{C}$	-	-	0.1	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=20\text{V}$	-	-	200	nA
动态特性						
输入电容	C_{iss}	$V_{CE}=25\text{V}$ $V_{GE}=0\text{V}$ $f=1\text{MHz}$	-	2750	-	pF
输出电容	C_{oss}		-	85	-	
反馈电容	C_{rss}		-	48	-	
栅电荷	Q_G	$V_{CC}=600\text{V}, I_C=25\text{A}, V_{GE}=15\text{V}$	-	117	-	nC

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IGBT开关特性 (感性负载)						
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=25^\circ\text{C}$ $V_{CC}=600\text{V}, I_c=25\text{A}$ $V_{GE}=15/0\text{V}$ $R_G=15\Omega$ $L_{load}=500\mu\text{H}$	-	32	-	ns
上升时间	t_r		-	54	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		-	175	-	
下降时间	t_f		-	40	-	
开通损耗	E_{on}		-	1.4	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	0.6	-	
开关损耗	E_{ts}		-	2.0	-	
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=150^\circ\text{C}$ $V_{CC}=600\text{V}, I_c=25\text{A}$ $V_{GE}=15/0\text{V}$ $R_G=15\Omega$ $L_{load}=500\mu\text{H}$	-	29	-	ns
上升时间	t_r		-	49	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		-	200	-	
下降时间	t_f		-	57	-	
开通损耗	E_{on}		-	1.4	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	0.7	-	
开关损耗	E_{ts}		-	2.1	-	
二极管开关特性						
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=25^\circ\text{C}$ $V_R=600\text{V}, I_F=25\text{A}$ $di_F/dt=600\text{A}/\mu\text{s}$	-	58	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		-	1.1	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}		-	32	-	A
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=150^\circ\text{C}$ $V_R=600\text{V}, I_F=25\text{A}$ $di_F/dt=600\text{A}/\mu\text{s}$	-	78	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		-	1.8	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}		-	39	-	A

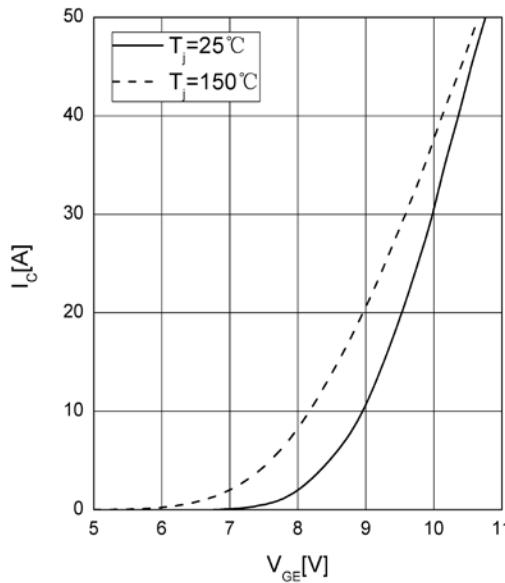
输出特性 IGBT
output characteristic IGBT
 $I_c = f(V_{CE})$, $V_{GE} = 15V$



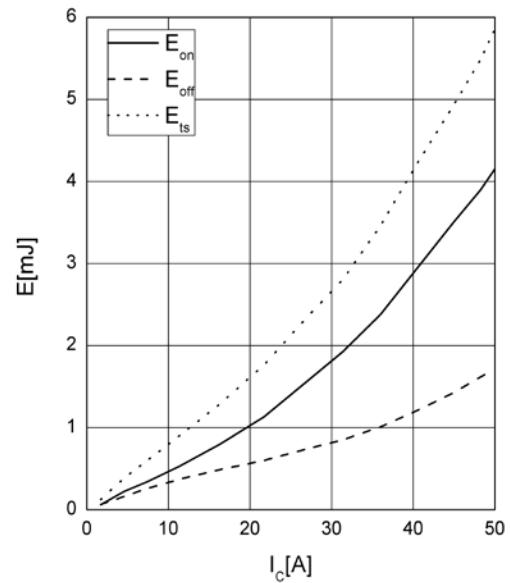
输出特性 IGBT
output characteristic IGBT
 $I_c = f(V_{CE})$, $T_j = 150^\circ C$



传输特性 IGBT
transfer characteristic IGBT
 $I_c = f(V_{GE})$, $V_{CE} = 20 V$



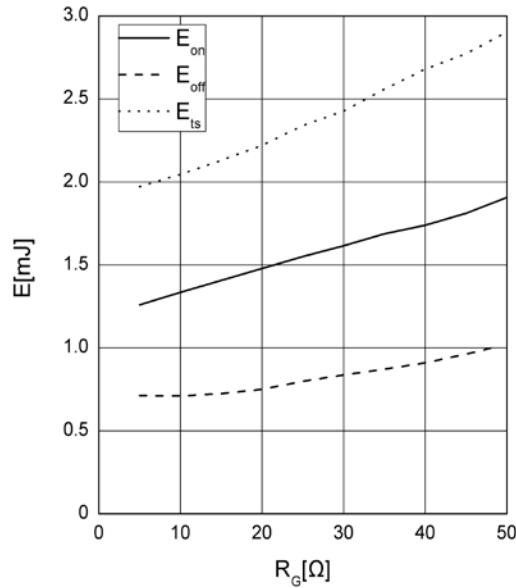
开关损耗 IGBT
switching losses IGBT
 $E_{on} = f(I_c)$, $E_{off} = f(I_c)$, $E_{ts} = f(I_c)$
 $V_{GE} = 15/0 V$, $R_G = 15 \Omega$, $V_{CE} = 600 V$, $T_j = 150^\circ C$



开关损耗 IGBT

switching losses IGBT

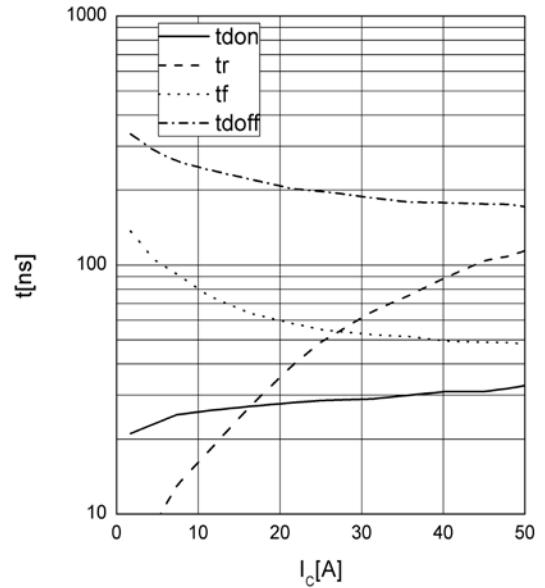
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{ts} = f(R_G)$
 $V_{GE} = 15/0 \text{ V}$, $I_C = 25 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$, $T_j = 150^\circ\text{C}$



开关时间 IGBT

switching times IGBT

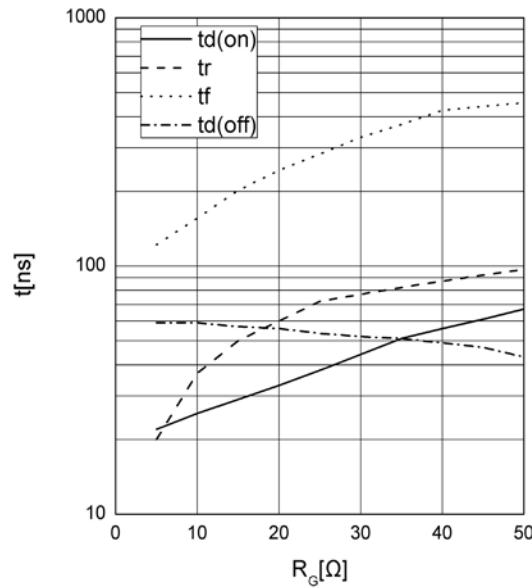
$t_{d(on)} = f(I_C)$, $t_r = f(I_C)$, $t_f = f(I_C)$, $t_{d(off)} = f(I_C)$
 $V_{GE} = 15/0 \text{ V}$, $R_G = 15 \Omega$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$, $T_j = 150^\circ\text{C}$



开关时间 IGBT

switching times IGBT

$t_{d(on)} = f(R_G)$, $t_r = f(R_G)$, $t_f = f(R_G)$, $t_{d(off)} = f(R_G)$
 $V_{GE} = 15/0 \text{ V}$, $I_C = 25 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$, $T_j = 150^\circ\text{C}$

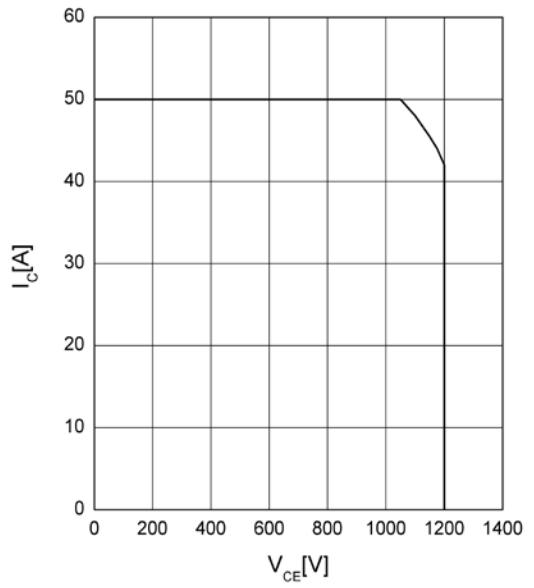


反偏安全工作区 IGBT

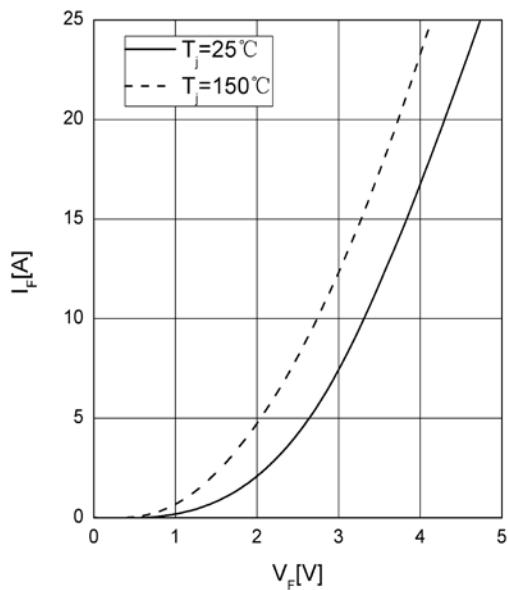
reverse bias safe operating area IGBT

$I_c = f(V_{CE})$

$V_{GE} = 15/0 \text{ V}$, $R_{Goff} = 15 \Omega$, $T_j = 150^\circ\text{C}$



正向偏压特性 二极管
forward characteristic of Diode
 $I_F = f(V_F)$



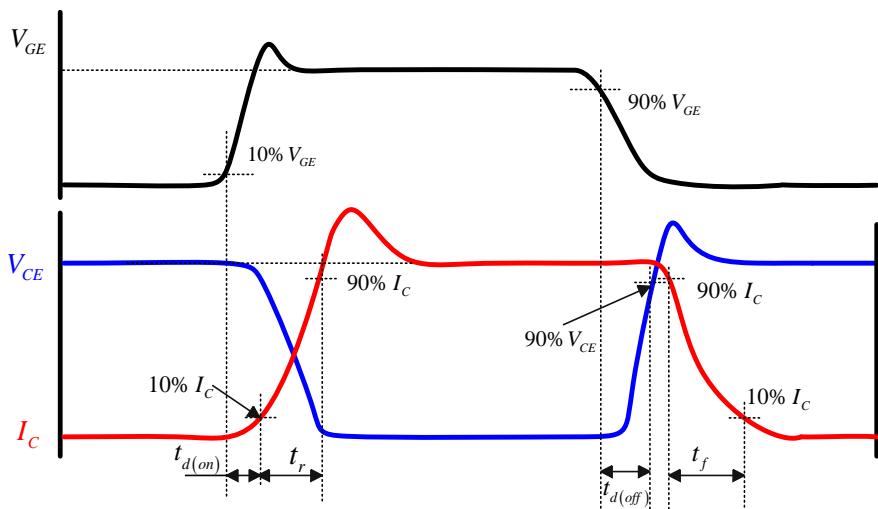


Figure A. Definition of switching times

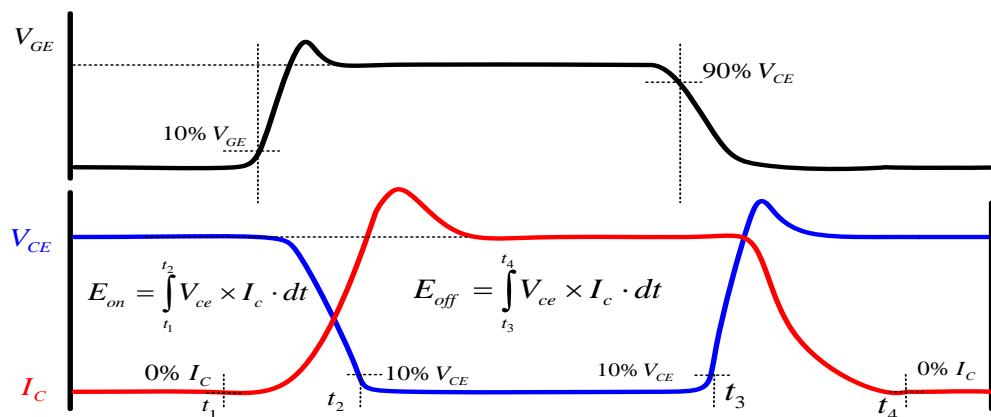


Figure B. Definition of switching losses

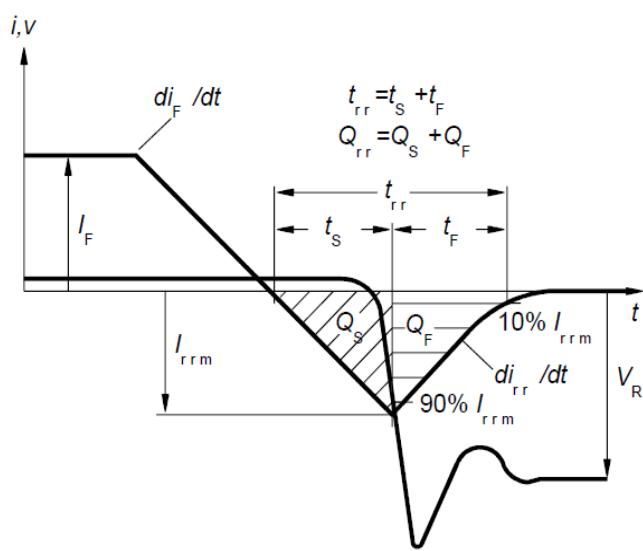


Figure C. Definition of diodes switching characteristics

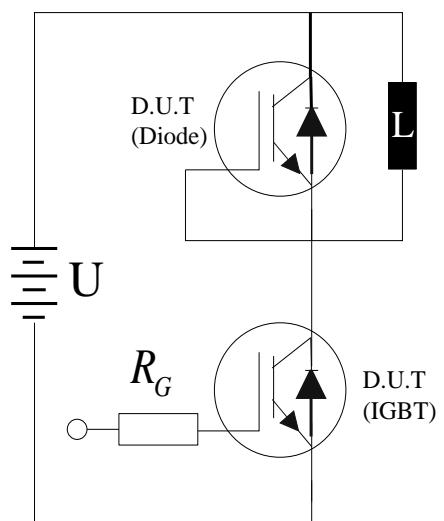
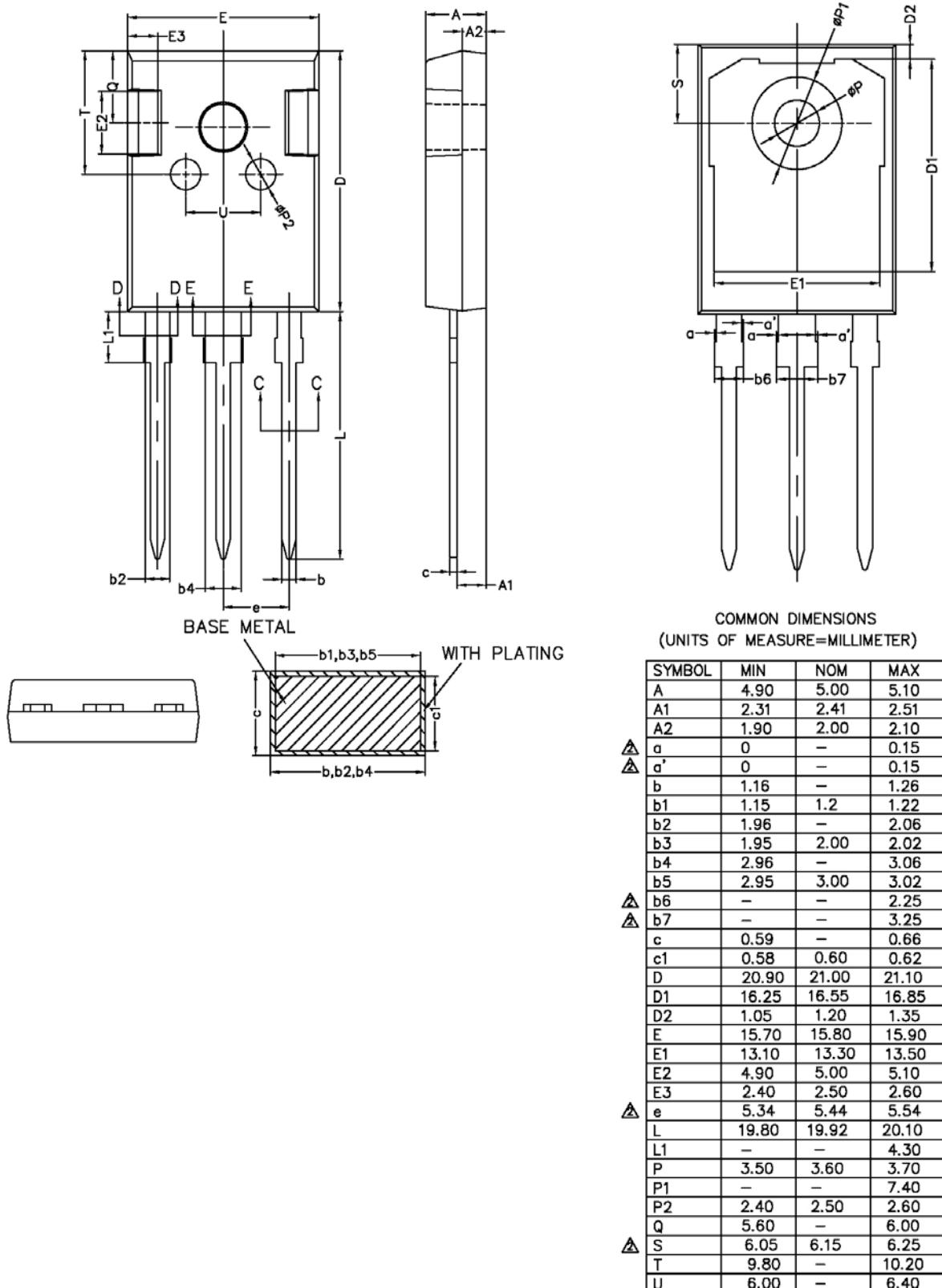


Figure D. Dynamic test circuit

TO-247



NOTES:
1. ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDARD
TO-247 AD DO NOT INCLUDE MOLD FLASH
OR PROTRUSIONS.
2. EJECTION MARK DEPTH $0.10^{+0.15}_{-0.05}$.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for IGBT Transistors category:

Click to view products by JUNSHINE manufacturer:

Other Similar products are found below :

[748152A](#) [FGH60T65SHD_F155](#) [APT100GT60B2RG](#) [APT13GP120BG](#) [APT20GN60BG](#) [APT20GT60BRDQ1G](#) [APT25GN120B2DQ2G](#)
[APT35GA90BD15](#) [APT36GA60BD15](#) [APT40GP60B2DQ2G](#) [APT40GP90B2DQ2G](#) [APT50GN120B2G](#) [APT50GT60BRG](#)
[APT64GA90B2D30](#) [APT70GR120J](#) [NGTB10N60FG](#) [NGTB30N60L2WG](#) [NGTG25N120FL2WG](#) [IGP30N60H3XKSA1](#) [STGB15H60DF](#)
[STGFW20V60DF](#) [STGFW30V60DF](#) [STGFW40V60F](#) [STGWA25H120DF2](#) [FGB3236_F085](#) [APT25GN120BG](#) [APT25GR120S](#)
[APT30GN60BDQ2G](#) [APT30GN60BG](#) [APT30GP60BG](#) [APT30GS60BRDQ2G](#) [APT30N60BC6](#) [APT35GP120JDQ2](#) [APT36GA60B](#)
[APT45GR65B2DU30](#) [APT50GP60B2DQ2G](#) [APT68GA60B](#) [APT70GR65B](#) [APT70GR65B2SCD30](#) [GT50JR22\(STA1ES\)](#) [TIG058E8-TL-H](#)
[IDW40E65D2](#) [SGB15N120ATMA1](#) [NGTB50N60L2WG](#) [STGB10H60DF](#) [STGB20V60F](#) [STGB40V60F](#) [STGFW80V60F](#)
[IGW40N120H3FKSA1](#) [RJH60D7BDPQ-E0#T2](#)